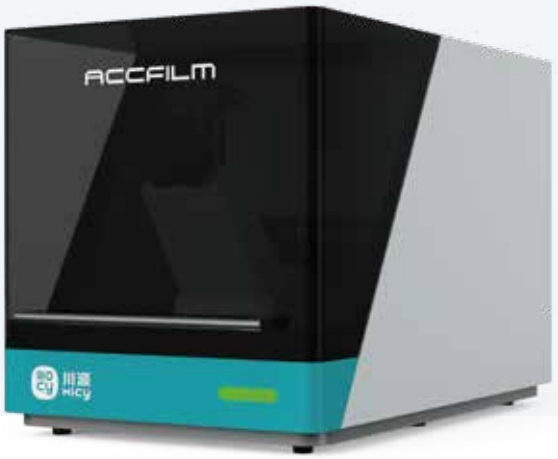
单颗粒力学测试仪

Particle Hardness Analyzer

扫码查看
更多此产品内容

该仪器用于测量单颗粒的**抗压强度**，适用于材料研发过程中的颗粒力学性能评价。可辅助筛选优质颗粒，提升电池**一致性**。产品为国产替代方案，相比进口设备具有成本优势。

- **单颗粒力学检测，面向研发场景**
- **压力分辨率±0.01mN，位移分辨率1nm**
- **国产替代，成本显著低于进口设备**



系统参数

项目	参数	参数
设备型号	Particle H1	Particle H2
产品功能	应力应变、压溃力等力学检测	应力应变、压溃力等力学检测(高通量)
测试对象	前驱体材料、固态电解质材料、阳极、阴极等颗粒	
位移 - 量程	0-95 μm	
位移 - 分辨率	0.001 μm	
位移 - 精度	0.35 μm	
压力 - 量程	0.01～100mN	0.01～200mN
压力 - 分辨率	0.1mN	0.01mN
压力 - 精度	±0.15mN	±0.05mN
压头类型	120° 三角锥压头	
最小位移单位	0.01 μm	0.003 μm
温湿度 - 量程	0-80°C / 5-95%RH	0-80°C / 5-95%RH
温湿度 - 精度	±2°C、±4%RH	±2°C、±4%RH
颗粒图像观察	有	
自动下压控制	有	
自动位移平台	有	
软件功能	• 全自动通讯连接 • 一键自动调零及校准 • 测量次数统计、单点、线性等测试模式可选 • 测量辅助判定	• 实时数据采集记录与预览 • 标准测试数据报告输出 • 过量程显示、测量异常检查
设备尺寸 (L*W*H, mm)	300*185*150	
设备质量 (kg)	38	